Search Notes



Application/Control No.

Applicant(s)/Patent under Reexamination

110

FENG KAI DI

Art Unit

10/791.067 Examiner

Ernest F. Karlsen

2829

SEARCHED				SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
ass	Subclass	Date	Examiner		DATE	EXMR
24	763 501 752 765 767	4/28/2005	£2,£	test same (wafer or die or ch.p) same optical and (photo adj detector or photodetector)	4/28/2005	C7×
14	733 734	4/28/2005	E.TX.	photodotoday		
-	:					
						1
					-	1
-						
		· · · - · - · · · · · · · · · · · · · ·				
			1			
-						1
	+				*	
	•					
			<u></u>			
INT	ERFERENC	E SEARCH	IED			
ass	Subclass	Date	Examiner			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				